

報道関係 各位

株式会社アドバンテスト

メモリ・テスト・システム「T5782」を販売開始

## 多品種なフラッシュ・マイコンに向けた 業界最高試験速度 266MHz のテスト

株式会社アドバンテスト(本社:東京都千代田区 社長:丸山利雄)は、品種が多岐に渡るフラッシュ・マイクロコントローラ(フラッシュ・メモリを内蔵したマイクロコントローラ。以下、フラッシュ・マイコン)のメモリ機能を業界最高試験速度266MHzで試験可能なメモリ・テスト・システム「T5782」を開発し、11月より販売を開始いたしました。

### ■ 開発の背景

日常生活で使用する冷蔵庫や洗濯機などの白物家電、および携帯電話に代表されるモバイル機器、さらには自動車などの製品における高機能化に向けた技術の進歩には目覚ましいものがあります。それらの製品の多くには心臓や頭脳の働きとしてフラッシュ・マイコンが組み込まれています。また製品の進化に伴い、フラッシュ・マイコンそのものも高速化、多品種化し、世代交代のスピードが早まってきており、フラッシュ・マイコンのメモリ機能の試験には、高速、かつ、より低コストのソリューションが求められてきました。

### ■ 新製品の特長

#### (1) 業界最高試験速度を実現

フラッシュ・マイコンのメモリ機能を対象に、将来の高速試験に対応した業界最高試験速度 **266MHz** を実現しました。世代交代が激しいフラッシュ・マイコンの試験においては、デバイスごとに交換される専用治具に関わる費用削減と、消費電力の低減が求められています。その要求に対して、従来の量産型テスト T5781 の最大同時測定数を半分に抑えることで、ランニング・コストを削減し、多品種なフラッシュ・マイコンの効率的な生産に寄与します。

#### (2) 各種メモリ測定機能を搭載

T5781 と同様、フラッシュ・メモリと DRAM の測定機能を搭載していますので、フラッシュ・メモリのウエハおよびパッケージ試験だけでなく、複数種のメモリが1パッケージに搭載された MCP(Multi Chip Package)の試験も可能となっています。

#### (3) 従来機種と機能を互換

T5782 は、T5781 と小型のエンジニアリング・タイプ・テストである T5781ES とテスト機能の互換性を持っています。それらを連携させることで、例えば T5781ES でデバイスを試験するためのプログラムを開発し、ウエハ試験には T5782、量産に向けたパッケージ試験には T5781 を使用するという効率的な試験ソリューションを提供できます。

定 価

メモリ・テスト・システム T5782 77 百万円から(構成により異なる)

販売目標

初年度 30 台

主な仕様

同時測定個数:最大 256 個(x8bit/x9bit, I/O シェアードモード使用の場合)

最大試験速度:266MHz / 533Mbps(DDR モード時)

テストヘッド:1 ステーション

製品に関するお問い合わせ先

営業本部 販売戦略統括部 電話:03-3214-7505

\*本ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な事象により予告無く変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。